

インライン粒子イメージアナライザー (PIA Particle Image Analyzer)

ドイツ SEQUIP 社(1993 年設立)は、従来の FBRM 法と比較し、高精度で、広範囲の粒子分布及び粒子サイズを測定できる ORM(Laser Optical Reflection Measurement)技術(特許)を開発しました。

また、粒度の情報に追加して、粒度の形状、結晶の包接、凝集等の情報も取得できる PIA システム(特許)を開発しました。

【PIA システムのアプリケーションの例】

- ・ 結晶析出と成長の観察においては、
結晶の伸長の関係(核形成、消滅)
窪みと丸みの関係
結晶の角ばった構造と摩擦箇所との関係
付属構造のモニタリングと評価
穴と窪みのモニタリングと評価
破壊粒子のモニタリングと評価
- ・ 結晶多形の検出
- ・ 溶解度の測定(濁度変化)
- ・ 触媒の表面特性
- ・ 医薬品合成中間体
- ・ グラニュール糖の結晶
- ・ プロテイン
- ・ ホルモン

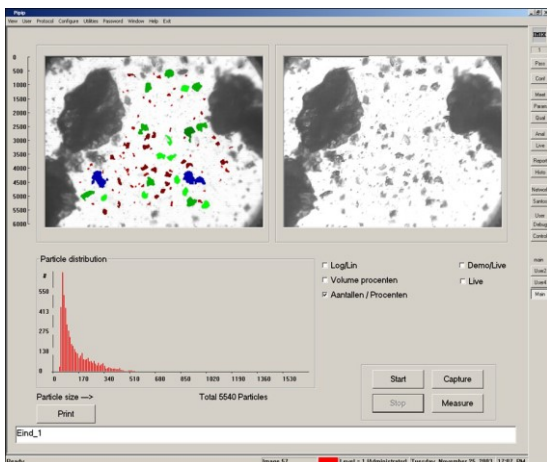


■ PIA-IVM(In situ Video Microscope) (特許) は画質、低濃度粒子での測定に威力を発揮します

PIA/IVM は、他の方法と比較して画質がよく、他の方法では測定できない低濃度での粒子の観察にもご使用になれます。このため結晶多形の観察にもご使用になれます。

■ インラインで直接粒子サイズを測定できます

直接粒子径と画像を測定できますので、オフラインでの分析がなくなり、製品の開発、改良が素早くできます。



【PIA/IVM ソフトウェア】



【PIA センサー】

